

Patentinformationen

Das europäische Patentamt (EPA) bietet Zugang zu weltweiten Patentinformationen über die Datenbank „Espacenet“: <http://ep.espacenet.com>.

Es gibt länderspezifische Zugänge zu Espacenet, die von den nationalen Patentämtern angeboten werden. Der Zugang für die Schweiz heisst: <http://ch.espacenet.com>.

Die Suchoberfläche ist überall dieselbe und wird auf Englisch, Deutsch und Französisch angeboten.

Erweiterte Suche

1. Datenbankwahl

Wählen Sie aus zwischen

- Worldwide
- EP – esp@cenet
- WIPO – esp@cenet

Die Datenbank „Worldwide“ deckt die meisten Dokumente ab. Weitere Angaben zum Dokumentenbestand dieser Datenbanken finden Sie unter „Inhalt“ auf den Seiten 2 und 3.

2. Suchfelder

Folgende Suchfelder stehen in der erweiterten Suche zur Verfügung:

- Schlagwörter im Titel
- Schlagwörter im Titel oder in der Zusammenfassung
- Veröffentlichungsnummer
- Anmeldenummer
- Prioritätsnummer
- Veröffentlichungsdatum
- Anmelder
- Erfinder
- Europäische Klassifikation (ECLA)
- Internationale Patentklassifikation (IPK)

Es steht eine Kurzhilfe Online zur Verfügung, die die einzelnen Suchfelder erläutert. Zudem finden Sie unter „Unterstützung“ verschiedene Tutorials, Tipps & Tricks und einen Help-Index.

Dokumentansichten

Öffnet man nach einer Suche ein Dokument aus der Resultatliste, erhält man folgende Ansichtsoptionen:

- Bibliografische Daten: Informationen wie Nummer des Patents, Namen des Erfinders und Anmelders, Klassifikationen, Veröffentlichungsnummer und –datum, etc. Zudem enthält diese Seite einen Link auf die „INPADOC Patentfamilie Seite“ mit verwandten Dokumenten sowie die Links auf andere (Sprach)-Versionen des Patents (unter „Auch veröffentlicht als“).
- Beschreibung: erster Dokumentabschnitt mit Beschreibung der Erfindung
- Patentansprüche: zweiter Dokumentabschnitt
- Mosaik: Zusammenstellung aller enthaltenen Illustrationen (können im Originaldokument ganzseitig betrachtet und ausgedruckt werden)
- Originaldokument: das vollständige Dokument, inkl. Beschreibung, Patentansprüche, Illustrationen.
- INPADOC Rechtsstand: Informationen zum Rechtsstand für Patente.

Obere Befehlsleiste

Bei allen Ansichtsoptionen hat man die Möglichkeit, sich eine eigene Liste von Dokumenten zusammenzustellen („In meine Patentliste übernehmen“) oder einzelne Seiten des Dokuments auszudrucken („Drucken“).

Für die Ansichtsoptionen „Mosaik“ und „Originaldokument“ hat man zusätzlich folgende Möglichkeiten:

- Maximieren: um einzelne Seiten vergrößert zu betrachten
- Vollständiges Dokument speichern: wählt man diese Option, öffnet sich ein Fenster mit einem „Nonsense“-Wort, das in das Feld eingetippt werden muss, damit man das Dokument öffnen oder speichern kann. Anschliessend kann man **das ganze Dokument ausdrucken**, ohne dass man Seite für Seite vorgehen muss.

Inhalt

1. Dokumentenbestand in der weltweiten Datenbank (Worldwide)

In der weltweiten Datenbank können Sie nach Informationen zu veröffentlichten Patentanmeldungen aus über 72 Ländern und Regionen suchen.

Die weltweite Datenbank basiert auf dem [PCT-Mindestprüfstoff](#), der von der [WIPO](#) als Mindestanforderung für Patentsammlungen festgelegt wurde, die der Ermittlung des Stands der Technik zur Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit dienen. Das EPA hat den Bestand seiner internen Datenbank über den PCT-Mindestprüfstoff hinaus auf Daten aus weiteren Ländern und Zeiträumen ausgedehnt. Außerdem werden im Rahmen der Prüfertätigkeit zusätzliche Informationen zu anderen Feldern hinzugefügt, wie z. B. [ECLA](#)-Symbole und Verweise auf [zitierte Dokumente](#).

Seit Februar 2005 werden europäische und britische Anmeldungen stets sofort am Veröffentlichungsdatum bereitgestellt.

Im September 2005 umfaßte *esp@cenet*® Daten zu 59 Mio. Patenten aus 72 Ländern. Von diesen Patenten weisen insgesamt 28,8 Mio. einen Titel, 26,8 Mio. ein ECLA-Symbol und 17,3 Mio. eine Zusammenfassung in englischer Sprache auf. Für die Schweiz enthält die Datenbank momentan ca. 692'000 Dokumente.

Einen Überblick über die Verfügbarkeit des PCT-Mindestprüfstoffs in der weltweiten Datenbank gibt die nachstehende Tabelle:

Land	Faksimile-Abbildungen ab	Zusammenfassungen ab	Europäische Klassifikation (ECLA)
CH	1888, beginnend mit CH1	1970	1920
DE	1877, beginnend mit DE1	1970	1877, beginnend mit DE1
EP	1978	1978	1978
FR	1920	1970	1902
GB	1920	1918	1909
US	1836, beginnend mit US1	1970	1920
WO	1978	1978	1978

2. Dokumentenbestand der EP-Datenbank

In dieser Datenbank können Sie nach Patentanmeldungen suchen, die das Europäische Patentamt in den letzten 24 Monaten veröffentlicht hat. Wenn Sie EP-Patente suchen, die älter als 24 Monate sind, sollten Sie eine Suche in der weltweiten Datenbank starten. Bei den EP-Patentdokumenten können nur die bibliographischen Daten durchsucht und angezeigt werden.

Hinweis: Die Felder "Zusammenfassung" und "Europäische Klassifikation" stehen nicht für die Suche zur Verfügung.

In der Regel werden die neuen Dokumente wöchentlich, d. h. am Tag der Veröffentlichung (Mittwoch), in die Datenbank geladen. In der weltweiten Datenbank stehen sie kurze Zeit später zur Verfügung.

Das neueste Dokument wird Ihnen auf der Startseite des *esp@cenet*®-Servers des EPA (ep.espacenet.com) unter der Rubrik "Eigene Abdeckung" angezeigt.

3. Dokumentenbestand der WIPO-Datenbank

In dieser Datenbank können Sie nach Patentanmeldungen suchen, die von der [WIPO](http://www.wipo.int) (Weltorganisation des geistigen Eigentum) in den letzten 24 Monaten veröffentlicht wurden (WO-Veröffentlichungen). Bei den WO-Patentschriften können nur die bibliographischen Daten durchsucht und angezeigt werden.

Hinweis: Die Felder "Zusammenfassung" und "Europäische Klassifikation" stehen nicht für die Suche zur Verfügung.

Wenn Sie WO-Patente suchen, die älter als 24 Monate sind, sollten Sie eine Suche in der weltweiten Datenbank starten.

In der Regel werden die neuen Dokumente wöchentlich in die Datenbank geladen, d.h. sie stehen derzeit zwei Wochen nach ihrer Veröffentlichung (Mittwoch) zur Verfügung. In der weltweiten Datenbank sind sie kurze Zeit später abrufbar.

Zusätzliche Suchmöglichkeiten für US-amerikanische Patente

Wenn Ihnen die Suchmöglichkeiten von *esp@cenet* nicht ausreichen (der Inhalt ist derselbe), können Sie nach US-amerikanischen Patenten auch auf der Seite des US Patent Office suchen: <http://www.uspto.gov/>

Angaben zum Inhalt dieser Datenbank findet man unter:
<http://www.uspto.gov/patft/help/contents.htm>.